



# Sistema Internacional de unidades:

Impacto y retos para su aplicación en la industria, la investigación y el desarrollo tecnológico.

AGENDA  
01 OCT

7:15 h	Ingreso y registro	Recepción INM de Colombia
8:15 h	Palabras de bienvenida	Ana Lucía Caicedo Viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad - MinCiencias <i>Pendiente por confirmar</i>
8:30 h	Palabras de apertura	Cielo Rusinque Superintendente de Industria y Comercio - Superintendencia de Industria y Comercio, SIC María del Rosario González Directora General - Instituto Nacional de Metrología, INM
9:00 h	Sofisticación e innovación para la productividad: el papel de la ciencia, tecnología e innovación	Paula Andrea Escobar Vicepresidente Asuntos Empresariales y Estratégicos Consejo Privado de Competitividad, CPC
9:30 h	Evolución y retos de la metrificación para los países de América Latina y su impacto en la competitividad	Héctor Vera Investigador Universidad Nacional Autónoma de México
10:00 h	Desafíos y oportunidades para la metrología legal en el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI)	Beatriz Sánchez Superintendente Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Superintendencia de Industria y Comercio, SIC
10:30 h	coffee break	
11:00 h	Experiencias de la asistencia técnica en la difusión y transición al uso del SI	Javier Fernández Coordinador Técnico Nacional ONUDI
11:30 h	<b>Panel</b> Oportunidades de apropiación del SI en la transferencia tecnológica y la innovación	Moderadora María del Rosario González Directora General Instituto Nacional de Metrología, INM
		Edwin Chistancho Director Ejecutivo ONAC
		Daniel Trillos Director de Normalización ICONTEC
		Héctor Vera Investigador Universidad Nacional Autónoma de México
12:30 h	Cierre del evento	Beatriz Sánchez Superintendente Delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Superintendencia de Industria y Comercio, SIC
		Carlos Robles Director ejecutivo Federación Colombiana de Acuicultores - FEDEACUA